

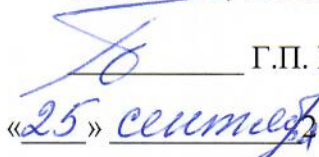


НАУЧНО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
КАЧЕСТВО

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НУЦ «Качество»

 Г.П. Батов

«25» сентября 2018 г.

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
РАДИАЦИОННОМУ МЕТОДУ КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ**

МОСКВА 2018

Темы	Всего часов	Количество часов	
		теория	практика
1. Общие сведения о радиационной дефектоскопии	4	4	
2. Физико-технические основы дефектоскопии	5	5	
3. Способы регистрации излучения	5	5	
4. Методика и технология радиационного контроля	5	5	
5. Типовые схемы радиационного контроля применяемые при просвечивании микроэлектроники	4	3	1
6. Различия между рентгеновским и гамма излучением	2	2	
7. Устройства рентгеновских и гамма аппаратов	6	4	2
8. Организация работ при контроле микроэлектроники	4	2	2
9. Подготовка источника излучения и принадлежностей к проведению контроля	3		3
10. Принцип работы сканирующих устройств и рентгено-электронных преобразователей	4	2	2
11. Способы визуализации рентгеновского излучения. Основные технические характеристики преобразователей	3	2	1
12. Подготовка контролируемого изделия к проведению контроля	3		3
13. Организация работ в фотолаборатории	5	1	4
14. Подготовка химических растворов для ручной или машинной обработки пленки	3		3
15. Требования, предъявляемые к рентгеновским снимкам, подлежащие расшифровки	3		3
16. Нормативно-техническая документация	4	4	
17. Составление технологической карты радиационного контроля изделий микроэлектроники	5	5	
18. Принцип работы дозиметрических приборов	2	2	
19. Техника безопасности и основы радиационной безопасности и дозиметрии	4	4	
20. Метрологические требования к приборам измерения и образцам оптической плотности	2	1	1
21. Экзамен	4	2	2
Итого:	80	53	27

Учебно-тематический план составил:

 Д.В. Дмитриев
(подпись)

« 25 » сентября 20 18 г.